

Качество выпускаемых толщиномеров пленок

Boguslavski, M.; **Laaneots, Rein** Метрология : ежемесячное приложение к научно-техническому журналу "Измерительная техника" 1972 / с. 59-62 https://www.ester.ee/record=b1940228*est

Критерии оценки толщины пленки

Boguslavski, M.; **Laaneots, Rein** Измерительная техника : ежемесячный научно-технический журнал 1972 / с. 35-36 : рис https://www.ester.ee/record=b1448551*est

Обеспечение единства измерений толщин пленок и покрытий

Boguslavski, M.; **Laaneots, Rein** Опыт внедрения методов и средств технического контроля качества на предприятиях Ленинграда : материалы к краткосрочному семинару 16-18 мая 1972 / с. 86-87